

走査型プローブ顕微鏡分科会 研究会のお知らせ

主題 走査型プローブ顕微鏡を利用した先端分析技術

日時 9月3日(火) 13:00~17:00、4日(水) 10:00~16:30

場所 幕張メッセ国際会議場 301A 会議室

最先端走査型プローブ顕微鏡 (SPM) の研究成果と、SPM を利用するための基本分析技術の解説を行うことを目的としたセミナーです。ナノスケールでの材料・デバイス計測のための基礎、および、動作状態での計測技術 (オペランド計測) 等を取り上げます。SPM メーカーからの最新の製品紹介も行われ、講師やメーカーの方と技術相談・機器導入相談も歓迎します。

参加費

3500 円 (学生無料)

事前申込

8/30 (金) までに氏名と所属を下記 E-Mail まで登録ください。

件名に「SPM セミナーJASIS」とご記載ください。

問い合わせ先

井藤浩志 (産業技術総合研究所)

TEL 029-861-5752

E-Mail h.itoh@aist.go.jp

リンク

<http://microscopy.or.jp/bunkakai/>

<https://www.jasis.jp/seminar/jasis-conf-list.html>

プログラム

9月3日(火)

13:00~13:05 開会挨拶 井藤 浩志 (産業技術総合研究所)

13:05~13:55 (仮) 原子分解能原子間力顕微鏡 杉本 宜昭 (東京大学)

13:55~14:45 (仮) 原子骨格の直接観察 川井 茂樹 (物質材料研究機構)

14:45~15:15 一般講演

15:15~15:30 休憩

15:30～15:55 (仮) SPM による有機材料分析 本田 暁紀

15:55～16:20 (仮) 電池材料の SPM 解析 橘田 晃宜

16:20～16:45 一般講演

16:45～16:55 閉会挨拶

9月4日(水)

10:00～10:05 開会挨拶・事務連絡 井藤浩志(産業技術総合研究所)

10:05～10:45 液中原子間力顕微鏡による2次元および3次元界面計測技術
福間 剛士(金沢大学ナノ生命科学研究所)

10:45～11:25 招待講演2

11:25～12:00 先端 AFM 機器の紹介

12:00～14:00 お昼休み ～JASIS 展示会をご見学ください～

14:00～14:05 事務連絡

14:05～14:45 NanoFTIR 法による複合材料解析 井藤 浩志(産業技術総合研究所)

14:45～15:10 一般講演1

15:10～15:35 一般講演2

15:35～16:00 一般講演3

16:00～16:10 閉会挨拶
